(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-327013 (P2002-327013A)

(43)公開日 平成14年11月15日(2002.11.15)

(51) Int.Cl.7	觀別記号	FI	テーマコード(参考)	
C08F 20/22		C08F 20/22	2H025	
22/40		22/40	4J032	
32/00		32/00	4J100	
34/00		34/00		
C 0 8 G 61/12		C 0 8 G 61/12		
	審査請求	未請求 請求項の数9 OL	(全 26 頁) 最終頁に続く	
(21) 出願番号	特願2002-50829(P2002-50829)	(71)出願人 000002060 信越化学工業	朱式会計	
(22)出顧日	平成14年2月27日(2002.2.27)	東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (71)出願人 000005821		
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日	特顧2001-53664 (P2001-53664) 平成13年 2 月28日 (2001. 2. 28)	松下電器産業権	松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地	
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(71) 出願人 000002200		
(31)優先権主張番号	特願2001-53669 (P2001-53669)	セントラル硝子株式会社		
(32)優先日	平成13年2月28日(2001.2.28)	山口県宇部市大宇沖宇部5253番地		
(33)優先權主張国	日本(JP)	(74)代理人 100079304		
	·	弁理士 小島	隆司 (外1名)	
		最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 高分子化合物、レジスト材料及びパターン形成方法

(57)【要約】

【解決手段】 式(1)の基を含有する高分子化合物。 【化1】

【効果】 本発明のレジスト材料は、高エネルギー線に 感応し、特に170 n m以下の波長における感度が優れ ている上、レジストの透明性が向上し、優れたプラズマ エッチング耐性を有する。 (2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で示される基を含有することを特徴とする、重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

1

【化1】

(式中、R¹~R³は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R²及びR³は環を形成してもよく、その場合は酸素、硫黄、窒素等のヘテロ原子を含んでもよい炭素数1~20のアルキレン基を表す。R¹及びR¹は水素原子、フッ素原子又は炭素数1~20の 20直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R⁵及びR¹のうち少なくとも一方は一個以上のフッ素原子を含む。R°とR¹は環を形成してもよく、その場合は炭素数1~20の直鎖状、分*

 R^{10} R^{10} R^{12} R^{14} R^{14} R^{10} R^{12} R^{14} R^{14} R^{10} R^{12} R^{14} R^{14} R^{14} R^{15} R^{16} R^{16} R^{17} R^{19} R^{19} R

(式中、 R° は請求項 1 中の式(1)又は請求項 2 中の式(1 a)で示される基を示す。 $R^{\circ} \sim R^{1^{\circ}}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 2$ 0 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。 R^{11} はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子を示す。 R^{11} 及び R^{11} は水素原子、メチル基、又はCH、 CO_2R^{11} を示す。 R^{11} は炭素数 $1 \sim 2$ 0 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、又は置換アルキル基である。 R^{11} は炭素数 $1 \sim 2$ 0 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基である。 R^{11} は炭素数 $1 \sim 2$ 0 の直鎖状、分岐状のアルキレン基である。 R^{11} 1 によっていましたアルキレン基である。 R^{11} 1 によっていましたの正式のようによっています。 R^{11} 1 によっています。 $R^$

【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか1項に 記載の高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

【請求項5】 (A)請求項1乃至請求項3のいずれか r,レーザー、又は軟X線であ1項に記載の高分子化合物、(B)有機溶剤、(C)酸 50 項8記載のバターン形成方法。

* 岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたア ルキレン基を表す。 a は 0 又は 1 である。)

【請求項2】 下記一般式(1a)で示される基を含有することを特徴とする請求項1記載の高分子化合物。 【化2】

$$R^2$$
 R^3
 R^2
 R^3
 R^2
 R^3
 R^3
 R^2
 R^3
 R^3
 R^3

(式中、 $R^1 \sim R^3$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。 R^1 と R^3 は環を形成してもよく、その場合は酸素、硫黄、窒素等のヘテロ原子を含んでもよい炭素数 $1 \sim 20$ のアルキレン基を表す。 aは0又は1である。bは $1 \sim 4$ の整数である。)【請求項3】 下記一般式(2-1)~(2-5)に示されるいずれかの部分構造を有することを特徴とする請求項1に記載の高分子化合物。

[化3]

$$R^0$$
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0

発生剤を含有することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項6】 更に塩基性化合物を含有する請求項5記載のレジスト材料。

【請求項7】 更に溶解阻止剤を含有する請求項5又は 請求項6記載のレジスト材料。

【請求項8】 (1)請求項4乃至7のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2)次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長100~180nm帯又は1~30nm帯の高エネルギー線で露光する工程と、(3)必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【請求項9】 前記髙エネルギー線がF,レーザー、Ar,レーザー、又は軟X線であるととを特徴とする請求・項8記載のパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微細加工技術に適したレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料のベースボリマーとして有用な高分子化合物並びにこれを含有するレジスト材料及びこれを用いたパターン形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、 LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの 10 微細化が求められている。微細化が急速に進歩した背景 には投影レンズの高NA化、レジストの性能向上、短波 長化が挙げられる。レジストの高解像度化及び高感度化 に関しては、光照射によって発生する酸を触媒とした化 学増幅ポジ型レジスト材料は優れた性能を有するもので あり、遠紫外線リソグラフィーにおいて特に主流なレジ スト材料になった(特公平2-27660号、特開昭6 3-27829号公報等に記載)。また、i線(365 nm) からKrF(248nm) への短波長化は大きな 変革をもたらし、KrFエキシマレーザー用レジスト材 20 料は0.30ミクロンプロセスに始まり、0.25ミク ロンルールを経て、現在0.18ミクロンルールの量産 化への適用へと展開している。更には、0.15ミクロ ンルールの検討も始まっており、微細化の勢いはますま す加速されている。

【0003】ArF(193nm)では、デザインルールの微細化を0.13μm以下にすることが期待されているが、ノボラックやボリビニルフェノール系等の従来用いられていた樹脂が193nm付近に非常に強い吸収を持つため、レジスト用のベース樹脂として用いることができない。そこで透明性と必要なドライエッチング耐性の確保のため、アクリルやシクロオレフィン系の脂環族系の樹脂が検討された(特開平9-73173号、特開平10-10739号、特開平9-230595号公報、WO97/33198)。

【0004】F、(157nm) に関しては0.10μm以下の微細化が期待されているが、透明性の確保がますます困難になり、ArF用ベースポリマーであるアクリル樹脂では全く光を透過せず、シクロオレフィン系においてもカルボニル結合を有するものは強い吸収を持つ 40とがわかった。また、KrF用ベースポリマーのポリビニルフェノールについては、160nm付近に吸収のウィンドウがあり、若干透過率が向上するものの、実用的なレベルにはほど遠いことが判明した。

【0005】本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、300nm以下、特にF,(157nm)、Kr,(146nm)、KrAr(134nm)、Ar,(126nm)等の真空紫外光における透過率に優れたレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料のベースポリマーとして有用な新規高分子化合物並びにこれを含むレジス50

ト材料及びこれを用いたパターン形成方法を提供することを目的にする。

[0006]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、含フッ素脂環式ユニットを有するエステル基をベースポリマー中に導入することにより、透明性が飛躍的に向上する上にドライエッチング耐性も確保できるレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料が得られること知見し、本発明をなすに至ったものである。

【0007】即ち、本発明は下記の高分子化合物、レジスト材料及びパターン形成方法を提供する。

請求項1:下記一般式(1)で示される基を含有するととを特徴とする、重量平均分子量1,000~500,000高分子化合物。

[8000]

[化4]

$$R^{2}$$

$$R^{2}$$

$$R^{3}$$

$$R^{4}$$

$$R^{6}$$

$$R^{6}$$

$$R^{7}$$

$$R^{6}$$

$$R^{5}$$

$$R^{6}$$

$$R^{7}$$

$$R^{6}$$

(式中、R'~R'は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R'及びR'は環を形成してもよく、その場合は酸素、硫黄、窒素等のヘテロ原子を含んでもよい炭素数1~20のアルキレン基を表す。R'及びR'は水素原子又はフッ素原子である。R'及びR'は水素原子、フッ素原子又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R'及びR'のうち少なくとも一方は一個以上のフッ素原子を含む。R'とR'は環を形成してもよく、その場合は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基を表す。aは0又は1である。)

請求項2:下記一般式(1a)で示される基を含有する ことを特徴とする請求項1記載の高分子化合物。

【化5】

$$R^2$$
 R^3
 R^2
 R^3
 R^3
 R^2
 R^3
 R^3
 R^3
 R^3
 R^3
 R^3

O 【0009】(式中、R¹~R³は水素原子、フッ素原

子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状 のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R *とR*は環を形成してもよく、その場合は酸素、硫黄、 窒素等のヘテロ原子を含んでもよい炭素数1~20のア ルキレン基を表す。aは0又は1である。bは1~4の*

$$R^{10}$$
 R^{10}
 R

(式中、R°は請求項1中の式(1)又は請求項2中の 式(la)で示される基を示す。R'~R'では水素原 子、フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状 もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル 基である。R¹¹はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子 20 を示す。R¹¹及びR¹¹は水素原子、メチル基、又はCH ,CO,R11を示す。R11は炭素数1~20の直鎖状、分 岐状もしくは環状のアルキル基、又は置換アルキル基で ある。R¹¹は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは 環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基で ある。cは0又は1である。)

請求項4:請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載 の高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。 請求項5: (A)請求項1乃至請求項3のいずれか1項 に記載の高分子化合物、(B)有機溶剤、(C)酸発生 30 剤を含有することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト 材料。

請求項6: 更に塩基性化合物を含有する請求項5記載の レジスト材料。

請求項7:更に溶解阻止剤を含有する請求項5又は請求 項6記載のレジスト材料。

請求項8:(1)請求項4乃至7のいずれか1項に記載 のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2)次い で加熱処理後、フォトマスクを介して波長100~18 0 n m帯又は1~30 n m帯の高エネルギー線で露光す 40 る工程と、(3)必要に応じて加熱処理した後、現像液 を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパター ン形成方法。

請求項9:前記髙エネルギー線がF,レーザー、Aェ,レ ーザー、又は軟X線であることを特徴とする請求項8記 載のパターン形成方法。

【0010】本発明者の検討によれば、157nm付近 の透過率を向上させる方法としては、カルボニル基や炭 素 - 炭素間二重結合の数の低減化も一つの方法と考えら

*整数である。)

請求項3:下記一般式(2-1)~(2-5)に示され るいずれかの部分構造を有することを特徴とする請求項 1 に記載の高分子化合物。

【化6】

$$R^0$$
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0
 R^0

率向上に大きく寄与することがわかってきた。実際、ボ リビニルフェノールの芳香環にフッ素を導入したポリマ ーは実用的に近い透過率を得ることができた。しかしな がら、とのベースポリマーはF、レーザーのような高エ ネルギー光の照射によりネガ化が進行することが顕著に なり、レジストとしての実用化は難しいことが判明し た。これに対し、アクリル系樹脂やノルボルネン誘導体 由来の脂肪族環状化合物を主鎖に含有する高分子化合物 にフッ素を導入したポリマーは、吸収が低く抑えられる うえにネガ化の問題も解決できることがわかった。特 に、本発明のようにエステル側鎖に含フッ素脂環式ユニ ットを導入したポリマー類は157nm付近での透過率 が高い上に、優れたドライエッチング耐性を有すること が判明した。

【0011】以下、本発明について更に詳しく説明す る。本発明に係わる高分子化合物は、下記一般式(1) で示される基を有する重量平均分子量1,000~50 0,000のものである。

【化7】

$$R^{2} \xrightarrow{R^{3}} R^{3}$$

$$R^{4} \xrightarrow{R^{6}} R^{6}$$

$$R^{6}$$

$$R^{7}$$

$$R^{7}$$

$$R^{8}$$

$$R^{6}$$

$$R^{7}$$

$$R^{7}$$

$$R^{8}$$

$$R^{6}$$

(式中、R1~R3は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又 はフッ素化されたアルキル基である。R'とR'は環を形 成してもよく、その場合は酸素、硫黄、窒素等のヘテロ 原子を含んでもよい炭素数1~20のアルキレン基を表 す。R'及びR'は水素原子又はフッ素原子である。R' 及びR'は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~20 れるが、ベースポリマー中へのフッ素原子の導入も透過 50 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素

化されたアルキル基であり、R®及びR®のうち少なくと も一方は一個以上のフッ素原子を含む。R6とR7は結合 して環を形成してもよく、その場合は炭素数1~20の 直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素 化されたアルキレン基を表す。aは0又は1である。) 【0012】この場合、R⁶とR⁷とが結合して環を形成 したものとしては、特に下記一般式(1a)で示される 基が挙げられる。

[化8]

$$R^2$$
 R^3
 R^2
 R^3
 R^3
 R_2
 R_3
 R_4
 R_5
 R_5

(式中、R1~R3は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又 はフッ素化されたアルキル基である。R'とR'は環を形 20 成してもよく、その場合は酸素、硫黄、窒素等のヘテロ 原子を含んでもよい炭素数1~20のアルキレン基を表 す。aは0又は1である。bは1~4の整数である。) 【0013】 ことで、R1~R1は水素原子、フッ素原 子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状 のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R 1、R1はそれぞれ結合して環を形成してもよく、その場 合には酸素、硫黄、窒素などのヘテロ原子を含んでもよ い炭素数1~20のアルキレン基である。R'及びR'は 水素原子又はフッ素原子である。R⁶及びR⁷は水素原 子、フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状*

(2-1)(2-2)(2-3)

(式中、R°は式(1)又は(1a)の基を示す。R°~ R¹⁰は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直 鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化さ れたアルキル基である。R11はメチレン基、酸素原子又 は硫黄原子を示す。R11及びR11は水素原子、メチル 基、又はCH, CO, R''を示す。R''は炭素数1~20 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、又は置換

*もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル 基であり、R*及びR'のうち少なくとも一方は一個以上 のフッ素原子を含む。R⁶とR'は結合して環を形成して もよく、その場合は炭素数1~20の直鎖状、分岐状も しくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレ ン基を表す。なお、aは0又は1であり、またbは1~ 4の整数である。

【0014】この場合、炭素数1~20の直鎖状、分岐

状もしくは環状のアルキル基としては、メチル基、エチ 10 ル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プロピル基、 sec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロペンチ ル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル基、n-オクチル基等が例示でき、特に炭素数1~12、とりわ け炭素数1~10のものが好ましい。なお、フッ素化さ れたアルキル基は、上記アルキル基の水素原子の一部又 は全部がフッ素原子で置換されたものであり、トリフル オロメチル基、2、2、2-トリフルオロエチル基、 3, 3, 3-トリフルオロプロビル基、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロイソプロピル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロビル基等が挙 げられる。更に、炭素数1~20のアルキレン基、フッ 素化されたアルキレン基は、上記炭素数1~20のアル キル基、フッ素化されたアルキル基から水素原子が1個 脱離したものが挙げられ、炭素数が1~12、とりわけ 炭素数1~10のものが好ましい。

【0015】上記式(1)又は(1a)で示される基を 有する髙分子化合物としては、下記一般式(2-1)~ (2-5) に示されるいずれかの繰り返し単位を有する ものが好ましい。

【化9】

30

岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたア ルキレン基である。cは0又は1である。)

【0016】なお、上記アルキル基、フッ素化されたア ルキル基、アルキレン基、フッ素化されたアルキレン基 としては、先に例示したものと同様のものが例示され る。

【0017】一般式(1)又は(1a)で表される置換 アルキル基である。R¹¹は炭素数1~20の直鎖状、分 50 基を具体的に例示すると下記のようなものが挙げられ

る。なお、下記例でEtはエチル基を示す。

*【化10】

[0018]

.Et (CF₂)₃CF₃ (CF₂)₅CF₃ (CF₂)₃CF₃ (CF₂)₅CF₃ (CF2)3CF3 (ĆF₂)₅CF₃ (CF2)5CF3 (CF2)3CF3 (CF2)6CF3 (CF2)5CF3 (CF₂)₅CF₃ (CF₂)₅CF₃ (CF₂)₅CF₃ (CF2)5CF3 (CF₂)₅CF₃

【0019】本発明の高分子化合物は、繰り返し単位 $(2-1) \sim (2-5)$ のいずれかだけでも酸脱離性を 有するが、レジストの解像性を向上させる点から、上記

※のいずれか1又は2以上の単位を導入することができる。

[0020]

【化11】

単位に加えて下記繰り返し単位(3-1)~(3-5)※40

 R^{10} R^{10} R^{11} R^{11} R

(式中、R*~R¹'、cは上記と同じであり、R¹'は酸 50 不安定基を表す。)

上記R10の酸不安定基としては種々選定されるが、特に下記式(4)~(6)で示される基等であることが好ましい。

[0021] [化12]

【0022】式(4)において、R¹¹は炭素数4~2 0、好ましくは4~15の三級アルキル基、炭素数4~ 20のオキソアルキル基又は上記一般式(6)で示される基を示し、三級アルキル基として具体的には、ter tーブチル基、tertーアミル基、1、1ージエチルプロピル基、1ーエチルシクロペンチル基、1ーブチル 20 シクロペンチル基、1ーエチルシクロペキシル基、1ーブチルシクロペキシル基、1ーエチルシクロペキシル基、2ー ブチルシクロペキシル基、1ーエチルー2ーシクロペンテニル基、2ー メチルー2ーアダマンチル基等が挙げられ、オキソアルキル基として具体的には、3ーオキソシクロペキシル 基、4ーメチルー2ーオキソオキサンー4ーイル基、5ーメチルー5ーオキソオキソランー4ーイル基等が挙げられる。dは0~6の整数である。

【0023】上記式(4)の酸不安定基としては、具体*

$$-(CH_2)_4$$
 $-OH$ $-(CH_2)_2$ $-O-(CH_2)_3$ $-(CH_2)_4$ $-CH_2OH$

【0026】R¹⁸とR¹⁸、R¹⁸とR¹⁹、R¹⁸とR¹⁹、R¹⁸とR¹⁹とR¹⁸、R¹⁸、R¹⁸、R¹⁸はそれぞれ炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。

【0027】上記式(5)で示される酸不安定基のうち 40

* 的にはtert-ブトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニルメチル基、tert-アミロキシカルボニルメチル基、1,1-ジエチルプロピルオキシカルボニル基、1,1-ジエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1-エチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、1-エチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、1-エチルー2-シクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1-エチルー2-シクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1-エチルー2-シクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2-テトラヒドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示できる。

【0024】式(5)において、R¹⁰、R¹⁰は水素原子又は炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、2-エチルペキシル基、n-オクチル基等を例示できる。R¹⁰は炭素数1~18、好ましくは1~10の酸素原子等のペテロ原子を有してもよい1価の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に置換されたものを挙げることができ、具体的には下記の置換アルキル基等が例示できる。

[0025] 【化13】

(7)

---(CH₂)₆---ОН

直鎖状又は分岐状のものとしては、具体的には下記の基が例示できる。

[0028]

【化14】

【0029】上記式(5)で示される酸不安定基のうち 2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル 基、テトラヒドロピラン-2-イル基、2-メチルテト ラヒドロピラン-2-イル基等が例示できる。式(5) としては、エトキシエチル基、ブトキシエチル基、エト キシプロピル基が好ましい。

【0030】次に、式(6)においてR²¹、R²²、R²³ は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアル キル基等の1価炭化水素基であり、酸素、硫黄、窒素、 フッ素などのヘテロ原子を含んでもよく、R²¹とR²¹、 R''とR''、R''とR''とは互いに結合して環を形成し 30 【化15】 てもよい。

*【0031】式(6) に示される三級アルキル基として. 環状のものとしては、具体的にはテトラヒドロフランー 20 は、tert‐ブチル基、トリエチルカルビル基、1‐ エチルノルボルニル基、1-メチルシクロヘキシル基、 1-エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダ マンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、te rt-アミル基、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2ーメチルーイソプロビル基、1、1、1、3、 3, 3-ヘキサフルオロ-2-シクロヘキシル-イソブ ロビル基等を挙げることができる他、下記に示す基を具 体的に挙げることができる。

[0032]

【0033】 ことで、R**は炭素数1~6の直鎖状、分 岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル

基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ 50 ル基、sec-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシ

(9)

る。

* -、-NR²⁸-として含有又は介在することができる

(R'"はアルキル基を示す)。R''及びR''としては、

具体的には、メチル基、ヒドロキシメチル基、エチル

基、ヒドロキシエチル基、プロピル基、イソプロピル

基、n-ブチル基、sec-ブチル基、n-ペンチル 基、n-ヘキシル基、メトキシ基、メトキシメトキシ

基、エトキシ基、tert‐ブトキシ基等を例示でき

ル基、シクロプロビル基、シクロプロビルメチル基、シ * クロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基等を例示できる。R**は炭素数2~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはエチル基、プロビル基、イソプロビル基、nープチル基、secーブチル基、カクロプロビル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロプロビルメチル基、シクロブラルを含る。R**及びR**は水素原子、炭素数1~6のヘテロ原子を含んでもよい1価炭化水素基、炭素数1~6のヘテロ原子を10介してもよい1価炭化水素基を示し、この場合ヘテロ原子を10介してもよい1価炭化水素基を示し、この場合ヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子を挙げることができ、一〇H、一〇R**、一〇一、一Sー、一S(=〇)一、一NH*、一NHR**、一N(R**)、、NH*

15

 R^{10} R^{10} R^{11} R^{11} R^{11} R^{11} R^{12} R^{13} R^{13} R^{12} R^{13} R^{13}

【0034】本発明の高分子化合物は、上記単位に加え 10 て透明性を向上させる点から下記繰り返し単位(7-1)~(7-5)のいずれか1又は2以上の単位を導入 することができる。 【0035】 【化16】

(式中、R*~R**、cは上記と同じであり、R**は炭素数2~20のフッ素化アルキル基を表す。)
【0036】R**はフッ素化アルキル基であり、2,
2,2ートリフルオロエチル基、3,3,3ートリフルオロプロビル基、1,1,1,3,3,3ーヘキサフルオロイソプロビル基、1,1,2,2,3,3,3-へ30プタフルオロプロビル基、2,2,3,3,4,4, ※

※5,5-オクタフルオロベンチル基等が挙げられる。 【0037】本発明の高分子化合物は上記単位に加えて、密着性を向上させる点から下記繰り返し単位(8-1)~(8-5)のいずれか1又は2以上の単位を導入することができる。

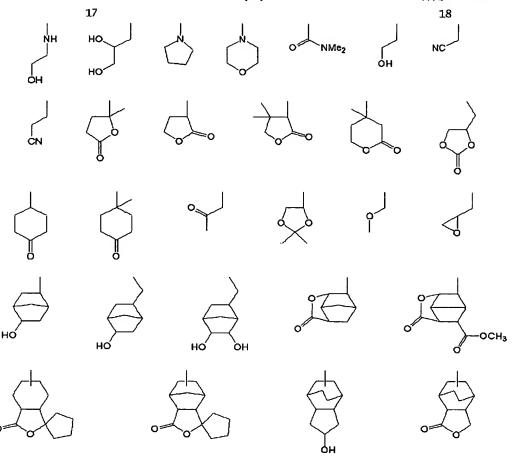
[0038]

【化17】

ては、下記に表されるようなものが挙げられる。

(式中、R*~R*、cは上記と同じであり、R**は水素原子又は密着性基を表す。) 【0039】上記R**で表される密着性基の具体例とし

[0040] [化18]



【0041】更に、本発明の髙分子化合物は(8-1) *【0042】 ~(8-5)の単位の他にも、密着性を向上させる点か **ら下記のような密着性基を導入することができる。**

(式中、R**及びR**は水素原子、又は炭素数1~20 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素 化されたアルキル基である。eは0~4の整数であ る。)

【0043】本発明の高分子化合物を合成する場合、上 記式(1)又は(1a)の基を有するモノマー、特に (2-1)~(2-5)の単位を与えるモノマー、更に 必要により酸脱離性モノマー(3-1)~(3-5)、 透明性向上モノマー (7-1)~(7-5) 及び密着性 向上モノマー(8-1)~(8-5)などを溶媒に溶解 50 らの重合はその常法に従って行うことができる。

させ、触媒を添加して、場合によっては加熱又は冷却し ながら重合反応を行う。重合反応は開始剤(又は触媒) の種類、開始の方法(光、熱、放射線、プラズマ等)、 重合条件(温度、圧力、濃度、溶媒、添加物)等によっ ても支配される。本発明の高分子化合物の重合において は、2,2'-アゾビスイソブチロニトリル(以下、A IBNと略記する)等のラジカルによって重合が開始さ れるラジカル共重合、アルキルリチウム等の触媒を用い たイオン重合(アニオン重合)等が一般的である。とれ

20

【0044】ラジカル重合開始剤としては特に限定され るものではないが、例として上記のAIBN、2,2' -アゾビス(4-メトキシ-2,4-ジメチルバレロニ トリル)、2,2'-アゾピス(2,4-ジメチルパレ ロニトリル)、2,2'-アゾビス(2,4,4-トリ メチルペンタン)等のアゾ系化合物、tert-ブチル パーオキシピバレート、ラウロイルパーオキサイド、ベ ンゾイルパーオキサイド、tert‐ブチルパーオキシ ラウレート等の過酸化物系化合物、また水溶性開始剤と しては過硫酸カリウムのような過硫酸塩、更には過硫酸 10 カリウムや過酸化水素等の過酸化物と亜硫酸ナトリウム のような還元剤の組み合わせからなるレドックス系開始 剤が例示される。重合開始剤の使用量は、種類、重合反 応条件等に応じて適宜変更可能であるが、通常は重合さ せるべき単量体全量に対して0.001~5重量%、特 に0.01~2重量%が採用される。

【0045】また、重合反応においては重合溶媒を用いてもよい。重合溶媒としては重合反応を阻害しないものが好ましく、代表的なものとしては、酢酸エチル、酢酸 n-ブチル等のエステル類、アセトン、メチルエチルケ 20トン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、トルエン、キシレン、シクロヘキサン等の脂肪族又は芳香族炭化水素類、イソプロピルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール類、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶剤が使用できる。これらの溶剤は単独でもあるいは2種類以上を混合しても使用できる。またドデシルメルカプタンのような公知の分子量調整剤を併用してもよい。【0046】重合反応の反応温度は重合開始剤の種類あるいは溶媒の沸点により適宜変更され、通常は20~2 30

【0047】 このようにして得られる本発明にかかる重合体の溶液又は分散液から、媒質である有機溶媒又は水を除去する方法としては、公知の方法のいずれも利用できるが、例を挙げれば再沈澱濾過又は減圧下での加熱留出等の方法がある。

00℃が好ましく、特に50~140℃が好ましい。か

かる重合反応に用いる反応容器は特に限定されない。

【0048】本発明の高分子化合物は、式(1)又は(1a)の基を有する単位[式(2-1)~(2-5)等の単位]をU1、式(3-1)~(3-5)で表され 40る酸脱離性基を有する単位をU2、式(7-1)~(7-5)で表される透明性ユニットの単位をU3、式(8-1)~(8-5)で表される密着性基もしくは他の密着性ユニットの単位をU4とする場合、

- (U1),1- (U2),2- (U3),3- (U4),4-と表すことができるが、f1~f4は、f1+f2+f3+f4=1で、

0. $1 \le f 1/(f 1+f 2+f 3+f 4) \le 0$. 9、 より好ましくは0. $2 \le f 1/(f 1+f 2+f 3+f 4) \le 0$. 5 0. $1 \le f 2 / (f 1 + f 2 + f 3 + f 4) \le 0$. 8、より好ましくは0. $2 \le f 2 / (f 1 + f 2 + f 3 + f 4) \le 0$. 5

0 ≤ f 3 / (f 1 + f 2 + f 3 + f 4) ≤ 0.5、より 好ましくは0 ≤ f 3 / (f 1 + f 2 + f 3 + f 4) ≤ 0.3

 $0 \le f 4 / (f 1 + f 2 + f 3 + f 4) \le 0.5$ 、より 好ましくは $0 \le f 4 / (f 1 + f 2 + f 3 + f 4) \le 0.3$ であることが好ましい。

【0049】上記高分子化合物の重量平均分子量は1,000~1,000,000、特に2,000~100,000とするととが望ましい。

【0050】本発明の高分子化合物は、レジスト材料、特に化学増幅型、とりわけ化学増幅ポジ型レジスト材料のベース樹脂として使用することができるが、膜の力学物性、熱的物性、アルカリ可溶性、その他の物性を変える目的で他の高分子化合物を混合することもできる。その際、混合する高分子化合物の範囲は特に限定されないが、レジスト用の公知の高分子化合物等と任意の範囲で混合することができる。

【0051】本発明のレジスト材料は、本発明の高分子 化合物をベース樹脂とする以外は公知の成分を用いて調 製し得るが、特に化学増幅ポジ型レジスト材料は、

(A)上記高分子化合物(ベース樹脂)、(B)有機溶剤、(C)酸発生剤を含有する。との場合、とれらレジスト材料に、更に(D)塩基性化合物、(E)溶解阻止剤を配合してもよい。

【0052】本発明で使用される(B)成分の有機溶剤 としては、ベース樹脂、酸発生剤、その他の添加剤等が 30 溶解可能であればいずれでもよい。このような有機溶剤 としては、例えばシクロヘキサノン、メチル-2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキシブタノール、 3-メチル-3-メトキシブタノール、1-メトキシー 2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等 のアルコール類、プロピレングリコールモノメチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコー ルモノエチルエーテル、プロピレングリコールジメチル エーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等の エーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテル アセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、酢酸ブチ ル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシブ ロピオン酸エチル、酢酸tert‐ブチル、プロピオン 酸tert‐ブチル、プロピレングリコールモノter t - ブチルエーテルアセテート等のエステル類が挙げら

【0053】また、フッ素化された有機溶剤も用いるととができる。具体的に例示すると、2-フルオロアニソ 50-ル、3-フルオロアニソール、4-フルオロアニソー

ル、2,3-ジフルオロアニソール、2,4-ジフルオ ロアニソール、2、5ージフルオロアニソール、5、8 ージフルオロー1, 4ーベンゾジオキサン、2, 3ージ フルオロベンジルアルコール、1,3-ジフルオロ-2 -プロパノール、2', 4'-ジフルオロプロピオフェ ノン、2,4-ジフルオロトルエン、トリフルオロアセ トアルデヒドエチルヘミアセタール、トリフルオロアセ トアミド、トリフルオロエタノール、2,2,2-トリ フルオロエチルプチレート、エチルヘプタフルオロブチ レート、エチルヘプタフルオロブチルアセテート、エチ 10 ルヘキサフルオログルタリルメチル、エチルー3ーヒド ロキシー4、4、4ートリフルオロブチレート、エチル -2-メチル-4, 4, 4-トリフルオロアセトアセテ ート、エチルペンタフルオロベンゾエート、エチルペン タフルオロプロピオネート、エチルペンタフルオロプロ ピニルアセテート、エチルパーフルオロオクタノエー ト、エチルー4、4、4ートリフルオロアセトアセテー ト、エチルー4、4、4ートリフルオロプチレート、エ チルー4, 4, 4ートリフルオロクロトネート、エチル トリフルオロスルホネート、エチルー3-(トリフルオ 20 ロメチル) ブチレート、エチルトリフルオロピルベー ト、sec-エチルトリフルオロアセテート、フルオロ シクロヘキサン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタ フルオロー1ープタノール、1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘプタフルオロー7、7-ジメチルー4、6-オク タンジオン、1, 1, 1, 3, 5, 5, 5 – ヘプタフル オロペンタン-2, 4-ジオン、3, 3, 4, 4, 5, 5, $5 - ^7$ タフルオロ $-2 - ^7$ ンタノール、3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 - ヘプタフルオロー2 - ペンタノ ン、イソプロピルー4、4、4ートリフルオロアセトア セテート、メチルパーフルオロデナノエート、メチルパ ーフルオロ(2-メチル-3-オキサヘキサノエー ト)、メチルパーフルオロノナノエート、メチルパーフ ルオロオクタノエート、メチルー2、3、3、3ーテト ラフルオロプロピオネート、メチルトリフルオロアセト アセテート、1, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 6-オクタ フルオロ-2, 4-ヘキサンジオン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロー1-ペンタノール、 1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロ-1-デカノー ル、パーフルオロ(2,5-ジメチル-3,6-ジオキ 40 状又は環状のアルキル基、炭素数6~20のアリール サンアニオニック)酸メチルエステル、2 H-パーフル オロ-5-メチル-3, 6-ジオキサノナン、1H, 1 H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロノナン-1, 2-ジオール、1H, 1H, 9H-パーフルオロー1-ノナ ノール、1H, 1H-パーフルオロオクタノール、1 H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロオクタノール、2 -3, 6, 9, 12, 15-ペンタオキサオクタデカ ン、パーフルオロトリブチルアミン、パーフルオロトリ

ル-3,6,9-トリオキサドデカン酸メチルエステ ル、パーフルオロトリペンチルアミン、パーフルオロト リプロピルアミン、1 H, 1 H, 2 H, 3 H, 3 H - パ ーフルオロウンデカンー1,2-ジオール、トルフルオ ロブタノール、1, 1, 1-トリフルオロー5-メチル -2, 4-ヘキサンジオン、1, 1, 1-トリフルオロ -2-プロパノール、3,3,3-トリフルオロ-1-プロパノール、1,1,1-トリフルオロー2ープロピ ルアセテート、パーフルオロブチルテトラヒドロフラ ン、パーフルオロデカリン、パーフルオロ(1,2-ジ メチルシクロヘキサン)、パーフルオロ(1,3-ジメ チルシクロヘキサン)、プロピレングリコールトリフル オロメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール メチルエーテルトリフルオロメチルアセテート、トリフ ルオロメチル酢酸ブチル、3-トリフルオロメトキシブ ロピオン酸メチル、パーフルオロシクロヘキサノン、プ ロピレングリコールトリフルオロメチルエーテル、トリ フルオロ酢酸ブチル、1,1,1-トリフルオロ-5, 5-ジメチル-2, 4-ヘキサンジオン等が挙げられ る。

【0054】これらの溶剤は1種を単独で又は2種以上 を混合して使用することもできるが、これらに限定され るものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中で もレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れている ジエチレングリコールジメチルエーテルや 1 - エトキシ -2-プロパノールの他、安全溶剤であるプロビレング リコールモノメチルアセテート及びその混合溶剤が好ま しく使用される。

【0055】なお、上記溶剤の使用量は、ベース樹脂1 00部(重量部、以下同じ)に対し300~10.00 0部、特に500~5,000部が好ましい。

【0056】(C)成分の酸発生剤としては、下記一般 式(9)のオニウム塩、式(10)のジアゾメタン誘導 体、式(11)のグリオキシム誘導体、β-ケトスルホ ン酸誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジルスルホ ネート誘導体、スルホン酸エステル誘導体、イミドイル スルホネート誘導体等が挙げられる。

 $[0057](R^{33})_aM^+K^-$

(式中、R31はそれぞれ炭素数1~12の直鎖状、分岐 基、又は炭素数7~12のアラルキル基を示し、M・は ヨードニウム又はスルホニウムを表し、K-は非求核性 対向イオンを表し、gは2又は3である。)

【0058】R33のアルキル基としては、メチル基、エ チル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、2-オキ ソシクロペンチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基 等が挙げられる。アリール基としては、フェニル基、p ーメトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、p‐ter ヘキシルアミン、パーフルオロー2,5,8-トリメチ 50 t - ブトキシフェニル基、 m - t e r t - ブトキシフェ

エル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、4-ナロフェニル基、4-ブチルフェニル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。K-の非求核性対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハライドイオン、トリフレート、1,1,1-トリフルオロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベロンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネート、1,2,3,4,5-ペンタフルオロベンゼンスルホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられ

23

[0059] [化20]

$$R^{34}$$
— SO_2 — C — SO_2 — R^{35} (10)

(式中、R34及びR34は炭素数1~12の直鎖状、分岐 20 状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭 素数6~12のアリール基又はハロゲン化アリール基又 は炭素数7~12のアラルキル基を示す。)

【0060】R''及びR''のアルキル基としてはメチル 基、エチル基、プロビル基、ブチル基、アミル基、シク ロベンチル基、シクロヘキシル基、ノルボルニル基、ア ダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基と してはトリフルオロメチル基、2,2,2-トリフルオ ロエチル基、2,2,2-トリクロロエチル基、ノナフ ルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフ ェニル基、p-メトキシフェニル基、m-メトキシフェ ニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル 基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert - ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチル フェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチル フェニル基、4ープチルフェニル基、ジメチルフェニル 基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化ア リール基としてはフルオロフェニル基、クロロフェニル 基、1,2,3,4,5-ペンタフルオロフェニル基等 40 が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェ ネチル基等が挙げられる。

[0061] [化21]

は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、R''及びR''はそれぞれ炭素数1~6の直鎖状、分岐状のアルキレン基を示す。)

【0062】R³°~R³°のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、R³'及びR³'で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、R³'及びR³°のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0063】酸発生剤として具体的には、例えばトリフ ルオロメタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリ フルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフ ェニル)フェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン 酸ジフェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) フェニルヨードニ ウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスル ホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-ter t-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、トリ フルオロメタンスルホン酸ビス(p-tert-ブトキ シフェニル)フェニルスルホニウム、トリフルオロメタ ンスルホン酸トリス(p‐tert‐ブトキシフェニ ル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニ ルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p-ter . t - ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、p -トルエンスルホン酸ビス (p-tert-ブトキシフェ ニル)フェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸 トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウ ム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホ ニウム、ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、 トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルスルホニウ ム、p-トルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、 トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、p-トル エンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシク ロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホ ン酸ジメチルフェニルスルホニウム、p-トルエンスル ホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、トリフルオロメ タンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウ ム、p-トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニル スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフ チルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シク ロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホ ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(2-ノルボニ ル)メチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウ ム、エチレンビス[メチル(2-オキソシクロペンチ ル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート]、 1, 2'-ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオ フェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス (ベンゼ ンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (p-トルエンスル

40

25

アゾメタン、ビス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾ メタン、ビス(シクロペンチルスルホニル)ジアゾメタ ン、ピス (n-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (イソプチルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (sec -ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (n-プロピ ルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソプロピルスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (tert-ブチルスルホ ニル) ジアゾメタン、ビス (n-アミルスルホニル) ジ アゾメタン、ビス (イソアミルスルホニル) ジアゾメタ ン、ピス(sec-アミルスルホニル)ジアゾメタン、 ビス(tert-アミルスルホニル)ジアゾメタン、1 -シクロヘキシルスルホニル-1-(tert-ブチル スルホニル) ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホ ニル-1-(tert-アミルスルホニル)ジアゾメタ ン、1-tert-アミルスルホニル-1-(tert - ブチルスルホニル) ジアゾメタン等のジアゾメタン誘 導体、ビス-O-(p-トルエンスルホニル)-α-ジ メチルグリオキシム、ビス一〇一(pートルエンスルホ -μ) -α - υフェニルグリオキシム、ν2-0-0-0+-トルエンスルホニル) - α-ジシクロヘキシルグリオ 20 キシム、ビス-O-(p-hルエンスルホニル)-2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O-(p-ト ルエンスルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジ オングリオキシム、ビス-O-(n-ブタンスルホニ ル) - α - ジメチルグリオキシム、ピス - O - (n - ブ タンスルホニル) - α - ジフェニルグリオキシム、ビス -O-(n-ブタンスルホニル)-α-ジシクロヘキシ ルグリオキシム、ピス-O-(n-ブタンスルホニル) -2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O-(n-7)タンスルホニル)-2-3メチル-3, 4-4ン タンジオングリオキシム、ビス-O-(メタンスルホニ ル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス - O - (トリフ ルオロメタンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシ ム、ビス-〇-(1,1,1-トリフルオロエタンスル ホニル) $-\alpha$ - ジメチルグリオキシム、ビス-O- (t ert-ブタンスルホニル)-α-ジメチルグリオキシ ム、ビス-〇-(パーフルオロオクタンスルホニル)- α - ジメチルグリオキシム、ビス- O - (シクロヘキサ ンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス - Ο - (ベンゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシ ム、ビス-O-(p-フルオロベンゼンスルホニル)- α -ジメチルグリオキシム、ビス-O-(p-tert ーブチルベンゼンスルホニル) -α-ジメチルグリオキ シム、ビス-0-(キシレンスルホニル)-α-ジメチ ルグリオキシム、ピス-〇-(カンファ-スルホニル) - α - ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、 2-シクロヘキシルカルボニル-2- (p-トルエンス ルホニル)プロパン、2-イソプロピルカルボニル-2 - (p-トルエンスルホニル)プロパン等のβ-ケトス ルホン誘導体、ジフェニルジスルホン、ジシクロヘキシ 50 場合があり、15部より多いと透明性が低くなり解像性

ルジスルホン等のジスルホン誘導体、p-トルエンスル ホン酸2, 6-ジニトロベンジル、p-トルエンスルホ ン酸2, 4-ジニトロベンジル等のニトロベンジルスル ホネート誘導体、1、2、3-トリス(メタンスルホニ ルオキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(トリフルオ ロメタンスルホニルオキシ) ベンゼン、1,2,3-ト リス (p-トルエンスルホニルオキシ) ベンゼン等のス ルホン酸エステル誘導体、フタルイミドーイルートリフ レート、フタルイミドーイルートシレート、5ーノルボ 10 ルネン-2, 3-ジカルボキシイミド-イル-トリフレ ート、5-ノルボルネン-2,3-ジカルボキシイミド ーイルートシレート、5ーノルボルネンー2、3ージカ ルボキシイミドーイルーn - ブチルトリフレスルホネー ト等のイミドイルスルホネート誘導体等が挙げられる が、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホ ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (p-tert - ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキ シフェニル) スルホニウム、p - トルエンスルホン酸ト リフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p -tert-プトキシフェニル) ジフェニルスルホニウ ム、p-トルエンスルホン酸トリス (p-tert-ブ トキシフェニル) スルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタ ンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロ ヘキシル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン 酸(2-ノルボルニル)メチル(2-オキソシクロヘキ シル)スルホニウム、1,2'-ナフチルカルボニルメ チルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオニ ウム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビ ス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シ クロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (n-ブ チルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソブチルスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (sec-ブチルスルホニ ル) ジアゾメタン、ビス (n-プロピルスルホニル) ジ アゾメタン、ビス (イソプロピルスルホニル) ジアゾメ タン、ピス(tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタ ン等のジアゾメタン誘導体、ビス-〇-(p-トルエン スルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ピス - O -**(n-ブタンスルホニル)-α-ジメチルグリオキシム** 等のグリオキシム誘導体が好ましく用いられる。なお、 上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせ て用いることができる。オニウム塩は矩形性向上効果に 優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム誘導体は定 在波低減効果に優れるため、両者を組み合わせることに よりプロファイルの微調整を行うことが可能である。 【0064】酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部 に対して0.2~15部が好ましく、0.2部より少な いと露光時の酸発生量が少なく、感度及び解像性が悪い

が低下する場合がある。

【0065】(D)成分の塩基性化合物は、酸発生剤よ り発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を 抑制することができる化合物が適している。このような 塩基性化合物の配合により、レジスト膜中での酸の拡散 速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を 抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度 やパターンプロファイル等を向上することができる(特 開平5-232706号、同5-249683号、同5 - 158239号、同5-249662号、同5-25 10 ルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリ 7282号、同5-289322号、同5-28934 0号公報等記載)。

27

【0066】このような塩基性化合物としては、アンモ ニア、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成 アミン類、芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキ シル基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含 窒素化合物、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシ フェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素 化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。 【0067】第一級の脂肪族アミン類の具体例として は、メチルアミン、エチルアミン、n-プロピルアミ ン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、イソブチ ルアミン、sec-ブチルアミン、tert-ブチルア ミン、ペンチルアミン、tert-アミルアミン、シク ロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルア ミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミ ン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチルアミン、メ チレンジアミン、エチレンジアミン、テトラエチレンペ ンタミン等が例示される。

【0068】第二級の脂肪族アミン類の具体例として は、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーnープロピ ルアミン、ジイソプロピルアミン、ジーn-ブチルアミ ン、ジイソブチルアミン、ジーsec-ブチルアミン、 ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、ジヘキシ ルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘプチルアミ ン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルアミ ン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N-ジメ チルメチレンジアミン、N, N-ジメチルエチレンジア ミン、N、N-ジメチルテトラエチレンペンタミン等が 例示される。

【0069】第三級の脂肪族アミン類の具体例として は、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリーn-プロピルアミン、トリイソプロピルアミン、トリーnー ブチルアミン、トリイソプチルアミン、トリーSec-ブチルアミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチ ルアミン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルア ミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリ ノニルアミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミ ン、トリセチルアミン、N, N, N', N'-テトラメ チルメチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメ 50 誘導体、フェナントリジン誘導体、アクリジン誘導体、

チルエチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメ チルテトラエチレンペンタミン等が例示される。

【0070】混成アミン類の具体例としては、例えばジ メチルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベ ンジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルア ミン等が例示される。

【0071】芳香族アミン類の具体例としては、アニリ ン、N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プ ロピルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチ ン、エチルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルア ニリン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4 ーニトロアニリン、2,4-ジニトロアニリン、2,6 ージニトロアニリン、3,5-ジニトロアニリン、N, N-ジメチルトルイジン等のアニリン誘導体や、ジフェ ニル (p-トリル) アミン、メチルジフェニルアミン、 トリフェニルアミン、フェニレンジアミン、ナフチルア ミン、ジアミノナフタレン等が例示される。

【0072】複素環アミン類の具体例としては、ピロー 20 ル、2H-ピロール、1-メチルピロール、2, 4-ジ メチルピロール、2,5-ジメチルピロール、N-メチ ルピロール等のピロール誘導体、オキサゾール、イソオ キサゾール等のオキサゾール誘導体、チアゾール、イソ チアゾール等のチアゾール誘導体、イミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダ ゾール等のイミダゾール誘導体、ピラゾール誘導体、フ ラザン誘導体、ピロリン、2-メチル-1-ピロリン等 のピロリン誘導体、ピロリジン、N-メチルピロリジ ン、ピロリジノン、N-メチルピロリドン等のピロリジ 30 ン誘導体、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジン誘導 体、ピリジン、メチルピリジン、エチルピリジン、プロ ピルピリジン、プチルピリジン、4-(1-ブチルペン チル) ビリジン、ジメチルビリジン、トリメチルビリジ ン、トリエチルピリジン、フェニルピリジン、3-メチ ルー2-フェニルピリジン、4-tert-ブチルピリ ジン、ジフェニルビリジン、ベンジルピリジン、メトキ シピリジン、プトキシピリジン、ジメトキシピリジン、 1-メチル-2-ピリジン、4-ピロリジノピリジン、 1-メチル-4-フェニルピリジン、2-(1-エチル 40 プロピル) ピリジン、アミノピリジン、ジメチルアミノ ピリジン等のピリジン誘導体、ピリダジン誘導体、ピリ ミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピ ラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導体、ピペラジン誘導 体、モルホリン誘導体、インドール誘導体、イソインド ール誘導体、1H-インダゾール誘導体、インドリン誘 導体、キノリン、3-キノリンカルボニトリル等のキノ リン誘導体、イソキノリン誘導体、シンノリン誘導体、 キナゾリン誘導体、キノキサリン誘導体、フタラジン誘 導体、プリン誘導体、プテリジン誘導体、カルバゾール

(12c)

(16)

29

フェナジン誘導体、1,10-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グアニン誘導体、グアニン誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0073】カルボキシル基を有する含窒素化合物の具体例としては、アミノ安息香酸、インドールカルボン酸、ニコチン酸の他、アラニン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジン、3-アミノビラ 10ジン-2-カルボン酸、メトキシアラニン等のアミノ酸誘導体が例示される。スルホニル基を有する含窒素化合物の具体例としては、3-ピリジンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸ピリジニウム等が例示される。

【0074】水酸基、ヒドロキシフェニル基を含有する 含窒素化合物及びアルコール性含窒素化合物の具体例と しては、2-ヒドロキシピリジン、アミノクレゾール、 2, 4-キノリンジオール、3-インドールメタノール ヒドレート、モノエタノールアミン、ジエタノールアミ ン、トリエタノールアミン、N-エチルジエタノールア 20 N-エチルジェタノールア 20 N-エチルジェタン ミン、N, N-ジエチルエタノールアミン、トリイソプ ロパノールアミン、2,2'-イミノジエタノール、2 -アミノエタノール、3-アミノ-1-プロパノール、 4-アミノー1-ブタノール、4-(2-ヒドロキシエ チル) モルホリン、2-(2-ヒドロキシエチル) ピリ ジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、1-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル]ピペラジ ン、ピペリジンエタノール、1-(2-ヒドロキシエチ ル) ピロリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3-ピペリジノ-1,2-プロパンジオ 30 ール、3-ピロリジノー1,2-プロパンジオール、8 -ヒドロキシユロリジン、3-クイヌクリジノール、3 ートロパノール、1-メチルー2-ピロリジンエタノー ル、1-アジリジンエタノール、N-(2-ヒドロキシ エチル) フタルイミド、N-(2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミド等が例示される。

【0075】アミド誘導体の具体例としては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベ 40ンズアミド等が例示される。イミド誘導体の具体例としては、フタルイミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。

【0076】更に下記一般式(12)で示される塩基性化合物から選ばれる1種又は2種以上を添加することもできる。

[0077]

【化22】

$$\begin{array}{c}
30 \\
(R^{39})_{h} \\
(R^{40})_{3-h}
\end{array}$$

$$-R^{41}-O-R^{42} \qquad (12a)$$

$$-R^{43}-O-R^{44} \xrightarrow{\parallel} R^{45} \qquad (12b)$$

$$O$$

(式中、h = 1 、2 、3 である。側鎖 R'' は同一でも異 なっていてもよく、互いに結合して環を形成することも でき、上記一般式(12a)、(12b)及び(12 c)で表すととができる。側鎖R1°は同一又は異種の、 水素原子もしくは直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1~ 20のアルキル基を示し、エーテル基もしくはヒドロキ シル基を含んでもよい。R''、R''、R''は炭素数1~ 4の直鎖状、分岐状のアルキレン基であり、R42、R45 は水素原子、炭素数1~20の直鎖状、分岐状、環状の アルキル基であり、ヒドロキシ基、エーテル基、エステ ル基、ラクトン環を1あるいは複数含んでいてもよい。 R**は単結合、炭素数1~4の直鎖状、分岐状のアルキ レン基であり、R''は炭素数1~20の直鎖状、分岐 状、環状のアルキル基であり、ヒドロキシ基、エーテ ル、エステル基、ラクトン環を1あるいは複数含んでい てもよい。)

【0078】上記一般式(12)で表される化合物は具体的には下記に例示される。

【0079】トリス(2-メトキシメトキシエチル)ア ミン、トリス {2-(2-メトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス(2-(2-メトキシエトキシメトキ シ) エチル} アミン、トリス {2-(1-メトキシエト キシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシエ トキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシ プロポキシ) エチル} アミン、トリス [2-{2-(2 ーヒドロキシエトキシ) エトキシ} エチル] アミン、 4, 7, 13, 16, 21, 24-ヘキサオキサー1, 10-ジアザビシクロ[8.8.8] ヘキサコサン、 4, 7, 13, 18-テトラオキサー1, 10-ジアザ ビシクロ[8.5.5] エイコサン、1,4,10,1 3-テトラオキサー7,16-ジアザビシクロオクタデ カン、1-アザ-12-クラウン-4、1-アザ-15 ークラウン-5、1-アザ-18-クラウン-6、トリ ス(2-フォルミルオキシエチル)アミン、トリス(2 -アセトキシエチル)アミン、トリス(2-プロピオニ ルオキシエチル) アミン、トリス(2-ブチリルオキシ エチル) アミン、トリス(2-イソブチリルオキシエチ ル) アミン、トリス(2-バレリルオキシエチル) アミ 50 ン、トリス(2ービバロイルオキシキシエチル)アミ

ン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (アセ トキシアセトキシ) エチルアミン、トリス (2-メトキ シカルボニルオキシエチル) アミン、トリス(2-te rtーブトキシカルボニルオキシエチル)アミン、トリ ス「2-(2-オキソプロポキシ) エチル] アミン、ト リス [2-(メトキシカルボニルメチル) オキシエチ ル] アミン、トリス [2-(tert-ブトキシカルボ ニルメチルオキシ) エチル] アミン、トリス [2-(シ クロヘキシルオキシカルボニルメチルオキシ) エチル] アミン、トリス(2-メトキシカルボニルエチル)アミ 10 ン、トリス(2-エトキシカルボニルエチル)アミン、 $N. N- \forall z (2- \forall F \Box + \forall x \ne y) (2- \forall x \ne y)$ カルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-アセト キシエチル) 2 - (メトキシカルボニル) エチルアミ ン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(エト キシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-ア セトキシエチル) 2 - (エトキシカルボニル) エチルア ミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(2 -メトキシエトキシカルボニル) エチルアミン、N, N ービス(2 – アセトキシエチル)2 – (2 – メトキシエ 20 シカルボニルメチル)アミン、N – ヘキシルビス(メト トキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2-(2-ヒドロキシエトキシカル ボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-アセトキシ エチル)2-(2-アセトキシエトキシカルボニル)エ チルアミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2 [(メトキシカルボニル)メトキシカルボニル]エチ ルアミン、N、N-ビス(2-アセトキシエチル)2-[(メトキシカルボニル)メトキシカルボニル]エチル アミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2-(2-オキソプロポキシカルボニル) エチルアミン、 N, N-ビス(2-アセトキシエチル)2-(2-オキ ソプロポキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (テトラヒドロフルフリ ルオキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2 -アセトキシエチル)2-(テトラヒドロフルフリルオ キシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-ヒ ドロキシエチル) 2 - [(2-オキソテトラヒドロフラ ン-3-4ル) オキシカルボニル] エチルアミン、N, N-ビス(2-アセトキシエチル)2-[(2-オキソ テトラヒドロフラン-3-イル)オキシカルボニル] エ 40 ル] モルホリン、1-[2-[(2-メトキシエトキ チルアミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2- (4-ヒドロキシブトキシカルボニル)エチルアミ ン、N、N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)2-(4-ホルミルオキシブトキシカルボニル) エチルアミ ン、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)2-(2-ホルミルオキシエトキシカルボニル) エチルアミ ン、N, N-ビス(2-メトキシエチル)2-(メトキ シカルボニル) エチルアミン、N-(2-ヒドロキシエ チル) ビス [2-(メトキシカルボニル) エチル] アミ

シカルボニル) エチル] アミン、N-(2-ヒドロキシ エチル) ビス [2-(エトキシカルボニル) エチル] ア ミン、N-(2-アセトキシエチル) ビス[2-(エト キシカルボニル) エチル] アミン、N-(3-ヒドロキ シ-1-プロピル) ビス[2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(3-アセトキシ-1-プロピ ル) ピス [2-(メトキシカルボニル) エチル] アミ ン、N-(2-メトキシエチル) ピス [2-(メトキシ カルボニル) エチル] アミン、N-ブチルビス[2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-ブチルビ ス[2-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチル] アミン、N-メチルビス(2-アセトキシエチル)アミ ン、N-エチルビス (2-アセトキシエチル) アミン、 N-メチルビス (2-ピパロイルオキシキシエチル) ア ミン、N-エチルビス[2-(メトキシカルボニルオキ シ) エチル] アミン、N-エチルピス [2-(tert - ブトキシカルボニルオキシ) エチル] アミン、トリス (メトキシカルボニルメチル) アミン、トリス (エトキ シカルボニルメチル)アミン、N-ブチルピス(メトキ キシカルボニルメチル) アミン、β-(ジエチルアミ ノ) - 8 - バレロラクトンを例示できるが、これらに制 限されない。更に下記一般式(13)に示される環状構 造を持つ塩基化合物の1種あるいは2種以上を添加する とともできる。

[0080] [化23]

30

Ņ—R³⁹ (13)

(式中、R39は前述の通り、R49は炭素数2~20の直 鎖状、分岐状のアルキレン基であり、カルボニル基、エ ーテル基、エステル基、スルフィドを1個あるいは複数 個含んでいてもよい。)

【0081】上記一般式(13)で表される塩基を具体 的に例示すると、1-[2-(メトキシメトキシ)エチ ル] ピロリジン、1 - [2 - (メトキシメトキシ) エチ ル] ピペリジン、4-[2-(メトキシメトキシ)エチ シ) メトキシ] エチル] ピロリジン、1-[2-[(2 -メトキシエトキシ)メトキシ]エチル]ピペリジン、 4-[2-[(2-メトキシエトキシ) メトキシ] エチ ル] モルホリン、酢酸2-(1-ピロリジニル) エチ ル、酢酸2-ピペリジノエチル、酢酸2-モルホリノエ チル、ギ酸2-(1-ピロリジニル)エチル、プロピオ ン酸2-ピペリジノエチル、アセトキシ酢酸2-モルホ リノエチル、メトキシ酢酸2-(1-ピロリジニル)エ チル、4-[2-(メドキシカルボニルオキシ)エチ ン、N-(2-アセトキシエチル)ピス[2-(メトキ 50 ル]モルホリン、1-[2-(t-ブトキシカルボニル

オキシ) エチル] ピペリジン、4-[2-(2-メトキ シエトキシカルボニルオキシ) エチル] モルホリン、3 - (1-ピロリジニル) プロピオン酸メチル、3-ピペ リジノプロピオン酸メチル、3-モルホリノプロピオン 酸メチル、3-(チオモルホリノ)プロピオン酸メチ ル、2-メチル-3-(1-ピロリジニル)プロピオン 酸メチル、3-モルホリノプロピオン酸エチル、3-ピ ペリジノプロピオン酸メトキシカルボニルメチル、3-(1-ピロリジニル) プロピオン酸2-ヒドロキシエチ ル、3-モルホリノプロピオン酸2-アセトキシエチ ル、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸2-オキソ テトラヒドロフラン-3-イル、3-モルホリノプロピ オン酸テトラヒドロフルフリル、3-ビベリジノプロビ オン酸グリシジル、3-モルホリノプロピオン酸2-メ トキシエチル、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸 2-(2-メトキシエトキシ) エチル、3-モルホリノ プロピオン酸プチル、3-ピペリジノプロピオン酸シク ロヘキシル、α-(1-ピロリジニル) メチル-γ-ブ チロラクトン、β-ピペリジノ-γ-プチロラクトン、 β-モルホリノーδ-バレロラクトン、1-ピロリジニ ル酢酸メチル、ピペリジノ酢酸メチル、モルホリノ酢酸 メチル、チオモルホリノ酢酸メチル、1-ピロリジニル 酢酸エチル、モルホリノ酢酸2-メトキシエチルで挙げ ることができる。

【0082】更に、下記一般式 (14) \sim (17) で表 されるシアノ基を含む塩基化合物を添加することができる

【0083】 【化24】

$$(R^{39})_{3-h}$$
 (14) $(R^{49}-CN)_h$

$$(R^{39})_{3-h}$$
 (16) $(R^{49} - O - R^{50} - CN)_h$

$$R^{48}$$
 $N-R^{49}$ $O-R^{50}$ -CN (17)

(式中、R''、R''、及びhは前述の通り、R''及びR''は同一又は異種の炭素数 $1\sim4$ の直鎖状、分岐状のアルキレン基である。)

【0084】シアノ基を含む塩基は、具体的には3-

(ジエチルアミノ) プロピオノニトリル、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオノニト リル、N. N-ビス(2-アセトキシエチル)-3-ア ミノプロピオノニトリル、N. N-ビス(2-ホルミル オキシエチル) - 3 - アミノプロピオノニトリル、N. N-ピス(2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオ ノニトリル、N, N-ビス[2-(メトキシメトキシ) エチル] - 3 - アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル) -N-(2-メトキシエチル) -3-ア 10 ミノブロピオン酸メチル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオン 酸メチル、N-(2-アセトキシエチル)- N-(2-シアノエチル)-3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-シアノエチル) - N - エチル - 3 - アミノプロピ オノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-ヒドロキシエチル) -3-アミノプロピオノニトリル、 N-(2-アセトキシエチル)-N-(2-シアノエチ ル) -3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シア Jエチル) - N - (2 - ホルミルオキシエチル) - 3 -20 アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル) -N-(2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオノ ニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-[2-(メトキシメトキシ) エチル] -3-アミノプロピオノニト リル、N-(2-シアノエチル)-N-(3-ヒドロキ シー1-プロビル) -3-アミノプロピオノニトリル、 アノエチル) -3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-(3-ホルミルオキシ-1-プロピル) -3-アミノプロピオノニトリル、N-30 (2-シアノエチル)-N-テトラヒドロフルフリルー 3-アミノプロピオノニトリル、N, N-ビス (2-シ アノエチル) - 3 - アミノプロピオノニトリル、ジエチ ルアミノアセトニトリル、N, N-ビス (2-ヒドロキ シエチル) アミノアセトニトリル、N、N-ビス (2-アセトキシエチル)アミノアセトニトリル、N. N-ビ ス(2-ホルミルオキシエチル)アミノアセトニトリ ル、N, N-ビス(2-メトキシエチル)アミノアセト ニトリル、N, N-ビス[2-(メトキシメトキシ)エ チル] アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-40 (2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸メチ ル、N-シアノメチル-N-(2-ヒドロキシエチル) -3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-アセトキ シエチル) - N - シアノメチル - 3 - アミノプロピオン 酸メチル、N-シアノメチル-N-(2-ヒドロキシエ チル) アミノアセトニトリル、N-(2-アセトキシエ チル)-N-(シアノメチル)アミノアセトニトリル、 $N-\gamma P/\gamma J+ N-(2-\pi N)$ アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(2-メトキシエチル) アミノアセトニトリル、N-シアノメ 50 チル-N-[2-(メトキシメトキシ)エチル]アミノ

36

アセトニトリル、N- (シアノメチル) - N- (3-ヒ ドロキシ-1-プロピル) アミノアセトニトリル、N-(3-アセトキシー1-プロピル)-N-(シアノメチ ル) アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(3-ホルミルオキシー1-プロビル) アミノアセトニ トリル、N, N-ピス(シアノメチル)アミノアセトニ トリル、1-ピロリジンプロピオノニトリル、1-ピペ リジンプロピオノニトリル、4-モルホリンプロピオノ ニトリル、1-ピロリジンアセトニトリル、1-ピペリ ジンアセトニトリル、4-モルホリンアセトニトリル、 3-ジエチルアミノプロピオン酸シアノメチル、N, N -ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノブロビオ ン酸シアノメチル、N, N-ビス(2-アセトキシエチ ル) -3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)-3-アミノプロビ オン酸シアノメチル、N, N-ビス(2-メトキシエチ ル) -3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N. N-ビス[2-(メトキシメトキシ)エチル]-3-アミノ プロピオン酸シアノメチル、3-ジエチルアミノプロピ オン酸(2-シアノエチル)、N, N-ビス(2-ヒド 20 ロキシエチル) -3-アミノプロピオン酸(2-シアノ エチル)、N, N-ピス (2-アセトキシエチル) -3-アミノプロビオン酸(2-シアノエチル)、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)-3-アミノプロピ オン酸(2-シアノエチル)、N, N-ビス(2-メト キシエチル)-3-アミノプロピオン酸(2-シアノエ チル)、N, N-ビス[2-(メトキシメトキシ)ェチ ル]-3-アミノプロピオン酸(2-シアノエチル)、 1-ピロリジンプロピオン酸シアノメチル、1-ピペリ ジンプロピオン酸シアノメチル、4-モルホリンプロピ 30 オン酸シアノメチル、1-ピロリジンプロピオン酸(2 -シアノエチル)、1-ピペリジンプロピオン酸(2-シアノエチル)、4-モルホリンプロピオン酸(2-シ アノエチル)が例示される。

【0085】なお、上記塩基性化合物は1種を単独で又 は2種類以上を組み合わせて用いることができ、その配 合量は全ベース樹脂100部に対して0.01~2部、 特に0.01~1部が好適である。配合量が0.01部 未満であると添加剤としての効果が十分に得られない場 合があり、2部を超えると解像度や感度が低下する場合 40 がある。

【0086】(E)成分の溶解阻止剤は、酸の作用によ りアルカリ現像液への溶解性が変化する分子量3,00 0以下の化合物、特に分子量2,500以下のフェノー ルあるいはカルボン酸誘導体の水酸基の一部あるいは全 部を酸不安定基で置換した化合物が適している。酸不安 定基としては本発明に挙げられるフッ素を含むものであ ってもよいが、従来のフッ素を含まないものでもよい。 【0087】分子量2,500以下のフェノールあるい

エチリデン) ビスフェノール、[1, 1'-ピフェニル -4,4'-ジオール]-2,2'-メチレンピス[4 ーメチルフェノール]、4,4-ピス(4'-ヒドロキ シフェニル) 吉草酸、トリス (4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、1, 1, 1-トリス(4'-ヒドロキシフ ェニル) エタン、1, 1, 2-トリス(4'-ヒドロキ シフェニル) エタン、フェノールフタレイン、チモール フタレイン、3, 3'ージフルオロ[(1, 1'ービフ ェニル) -4, 4' -ジオール]、3, 3', 5, 5' ーテトラフルオロ[(1, 1'-ビフェニルー4, 4' -ジオール]、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ -1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ピスフェノ ール、4、4'ーメチレンビス[2-フルオロフェノー ル]、2,2'ーメチレンビス[4-フルオロフェノー ル]、4,4'-イソプロピリデンビス[2-フルオロ フェノール]、シクロヘキシリデンビス[2-フルオロ メチレン] ビス [2-フルオロフェノール]、4,4' -メチレンピス[2,6-ジフルオロフェノール]、 4, 4'-(4-フルオロフェニル) メチレンビス [2,6-ジフルオロフェノール]、2,6-ビス [(2-ヒドロキシ-5-フルオロフェニル)メチル] -4-フルオロフェノール、2,6-ビス[(4-ヒド ロキシー3-フルオロフェニル) メチル] -4-フルオ ロフェノール、2,4-ビス[(3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシフェニル)メチル]-6-メチルフェノール 等が挙げられ、酸に不安定な置換基としては、式(4) ~(6)と同様のものが挙げられる。

【0088】好適に用いられる溶解阻止剤の具体例とし ては、3, 3', 5, 5' - テトラフルオロ[(1,1'-ビフェニル)-4,4'-ジ-tert-ブトキ シカルボニル]、4,4'-[2,2,2-トリフルオ ロー1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェ ノールー4, 4'ージーtertーブトキシカルボニ ル、ビス(4-(2)ーテトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) メタン、ビス (4-(2'-テトラヒドロフ ラニルオキシ) フェニル) メタン、ピス (4-tert ープトキシフェニル) メタン、ビス(4-tertーブ トキシカルボニルオキシフェニル) メタン、ピス (4tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) メタン、ビス(4-(1'-エトキシエトキシ)フェニ ル) メタン、ビス(4-(1'-エトキシプロピルオキ シ) フェニル) メタン、2, 2-ビス(4'-(2'' -テトラヒドロピラニルオキシ))プロパン、2、2-ピス(4'-(2''-テトラヒドロフラニルオキシ) フェニル) プロパン、2, 2-ビス(4'-tert-ブトキシフェニル) プロパン、2,2-ビス(4'-t ert-ブトキシカルボニルオキシフェニル) プロバ ン、2,2-ビス(4-tert-プトキシカルボニルはカルボン酸誘導体としては、4,4'-(1-メチル 50 メチルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4'

- (1''-エトキシエトキシ)フェニル)プロパン、 2, 2-ビス(4'-(1''-エトキシプロビルオキ シ)フェニル)プロパン、4,4-ピス(4'-(2' 'ーテトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) 吉 草酸tert-ブチル、4,4-ビス(4′-(2'' -テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル) 吉草酸 t e rtープチル、4,4-ビス(4'-tertープトキ シフェニル)吉草酸tert-ブチル、4,4-ビス (4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル) 吉草酸tert-ブチル、4, 4-ピス(4'-ter t - ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) 吉草酸 tert-ブチル、4,4-ビス(4'-(1''-エ トキシエトキシ) フェニル) 吉草酸tert‐ブチル、 4, 4-ビス(4'-(1''-エトキシプロピルオキ シ)フェニル)吉草酸tert-ブチル、トリス(4-(2'ーテトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタ ン、トリス(4-(2'-テトラヒドロフラニルオキ シ) フェニル) メタン、トリス(4-tert-ブトキ シフェニル) メタン、トリス(4-tert-プトキシ カルボニルオキシフェニル) メタン、トリス (4-te 20 rt-ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル) メタ ン、トリス(4-(1′-エトキシエトキシ)フェニ ル) メタン、トリス(4-(1'-エトキシプロビルオ キシ) フェニル) メタン、1, 1, 2-トリス (4'-(2' 'ーテトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) エ タン、1, 1, 2-トリス(4'-(2''-テトラヒ ドロフラニルオキシ)フェニル)エタン、1,1,2-トリス(4'-tert-プトキシフェニル)エタン、 1, 1, 2-トリス(4'-tert-ブトキシカルボ ニルオキシフェニル) エタン、1,1,2-トリス (4'-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフ ェニル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'-(1'-エトキシエトキシ) フェニル) エタン、1, 1, 2-ト リス(4'-(1'-エトキシプロピルオキシ)フェニ ル) エタン、2-トリフルオロメチルベンゼンカルボン 酸1,1-tert-ブチル、2-トリフルオロメチル シクロヘキサンカルボン酸tert-ブチル、デカヒド ロナフタレン-2,6-ジカルボン酸tert-ブチ ル、コール酸tertープチル、デオキシコール酸te rtーブチル、アダマンタンカルボン酸tertーブチ 40 ル、アダマンタン酢酸tert-ブチル、1,1'-ビ シクロヘキシルー3, 3', 4, 4'ーテトラカルボン 酸テトラtert-ブチル等が挙げられる。

【0089】本発明のレジスト材料中における溶解阻止 剤の添加量としては、レジスト材料中のベース樹脂10 0部に対して20部以下、好ましくは15部以下であ る。20部より多いとモノマー成分が増えるためレジス ト材料の耐熱性が低下する。

【0090】本発明のレジスト材料には、上記成分以外

いる界面活性剤を添加することができる。なお、任意成 分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量と することができる。

【0091】ととで、界面活性剤としては非イオン性の ものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチ レンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフル オロアルキルアミンオキサイド、パーフルオロアルキル EO付加物、含フッ素オルガノシロキサン系化合物等が 挙げられる。例えばフロラード「FC-430」、「F 10 C-431」(いずれも住友スリーエム(株)製)、サ ーフロン「S-141」、「S-145」(いずれも旭 硝子(株)製)、ユニダイン「DS-401」、「DS -403」、「DS-451」(いずれもダイキン工業 (株)製)、メガファック「F-8151」(大日本イ ンキ工業(株)製)、「X-70-092」、「X-7 0-093」(いずれも信越化学工業(株)製)等を挙 げることができる。好ましくは、フロラード「FC-4 30」(住友スリーエム(株)製)、「X-70-09 3」(信越化学工業(株)製)が挙げられる。

【0092】本発明のレジスト材料を使用してパターン を形成するには、公知のリソグラフィー技術を採用して 行うことができる。例えばシリコンウエハー等の基板上 にスピンコーティング等の手法で膜厚が0.1~1.0 μmとなるように塗布し、これをホットプレート上で6 0~200℃、10秒~10分間、好ましくは80~1 50℃、30秒~5分間プリベークする。次いで目的の バターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上 にかざし、遠紫外線、エキシマレーザー、X線等の高エ ネルギー線もしくは電子線を露光量1~200mJ/c 30 m'程度、好ましくは10~100mJ/cm'程度とな るように照射した後、ホットプレート上で60~150 ℃、10秒~5分間、好ましくは80~130℃、30 秒~3分間ポストエクスポージャベーク (PEB) す る。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%のテトラ メチルアンモニウムヒドロキシド (TMAH) 等のアル カリ水溶液の現像液を用い、10秒~3分間、好ましく は30秒~2分間、浸漬 (dip)法、パドル (pud dle)法、スプレー(spray)法等の常法により 現像することにより基板上に目的のパターンが形成され る。なお、本発明材料は、特に高エネルギー線の中でも 254~120nmの遠紫外線又はレーザー、特に19 3nmOArF, 157nmOF₂, 146nmOK r₂、134nmのKrAr、126nmのAr₂等のレ ーザー、X線及び電子線による微細パターンニングに最 適である。また、上記範囲を上限及び下限から外れる場 合は、目的のパターンを得ることができない場合があ る。

[0093]

【発明の効果】本発明のレジスト材料は、高エネルギー に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されて 50 線に感応し、200nm以下、特に170nm以下の波 (21)

長における感度が優れているうえに、含フッ素脂環式ユ ニットの導入によりレジストの透明性が向上し、それと 同時に優れたプラズマエッチング耐性を有する。従っ て、本発明のレジスト材料は、これらの特性により、特 にF, レーザーの露光波長での吸収が小さいレジスト材 料となり得るもので、微細でしかも基板に対して垂直な パターンを容易に形成でき、このため超LSI製造用の 微細パターン形成材料として好適である。

39

[0094]

【実施例】以下、合成例及び実施例を示して本発明を具 10 体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるも のではない。

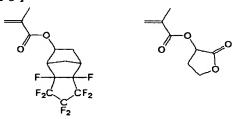
【0095】[合成例1]下記モノマー1、メタクリル 酸(2-エチルアダマンチル)及び下記モノマー2の共 重合(4:4:2)

500mLのフラスコ中で26.2gの下記モノマー1 と17.9gのメタクリル酸(2-エチルアダマンチ ル)、6.1gの下記モノマー2をトルエン100mL に溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤A IBNを0.34g仕込み、60℃まで昇温して24時 20 間重合反応を行った。

【0096】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をヘキサンに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、ヘキサン101中に注いでポリマーを沈澱させる操 作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。 このようにして得られた35.2gの白色重合体は光散 乱法により重量平均分子量が14,000であり、GP C溶出曲線より分散度 (= Mw/Mn) が1.4の重合 体であることが確認できた。得られたボリマーは'H-NMRの測定結果より、モノマー1とメタクリル酸(2 -エチルアダマンチル)とモノマー2を41:39:2 0の比で含むものであることがわかった。

[0097]

【化25】



Monomer 1

Monomer 2

【0098】[合成例2]モノマー1、メタクリル酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペ ンチル)、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及 びモノマー2の共重合(4:2:3:1) 500mLのフラスコ中で24.6gのモノマー1、1 0. 1gのメタクリル酸(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5.5-オクタフルオロペンチル)、12.6gのメタ 50 せ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤のAIBN

クリル酸(2-エチルアダマンチル)、2.9gの下記 モノマー2をトルエン100mLに溶解させ、十分に系 中の酸素を除去した後、開始剤AIBNを0.32g仕 込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行った。 【0099】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をヘキサンに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、ヘキサン10L中に注いでポリマーを沈澱させる操 作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。 このようにして得られた32.3gの白色重合体は光散 乱法により重量平均分子量が13,000であり、GP C溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.4の重合 体であることが確認できた。得られたポリマーは'H-NMRの測定結果より、モノマー1、メタクリル酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロベ ンチル)、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及 びモノマー2を39:20:31:10の比で含むもの であることがわかった。

【0100】[合成例3]モノマー1、メタクリル酸 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロベ ンチル)、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及 びモノマー2の共重合(3.5:1.5:3:2) 500mLのフラスコ中で22.8gのモノマー1、 8.0gのメタクリル酸(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,5-オクタフルオロベンチル)、13.3gのメタ クリル酸(2-エチルアダマンチル)、6.1gのモノ マー2をトルエン100mLに溶解させ、十分に系中の 酸素を除去した後、開始剤AIBNを0.34g仕込 み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行った。 【0101】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をヘキサンに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、ヘキサン10L中に注いでポリマーを沈澱させる操 作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。 このようにして得られた34.3gの白色重合体は光散 乱法により重量平均分子量が14,000であり、GP C溶出曲線より分散度 (= Mw/Mn) が1.5の重合 体であることが確認できた。得られたポリマーは¹H-NMRの測定結果より、モノマー1、メタクリル酸

ンチル)、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及 びモノマー2を33:16:31:20の比で含むもの であることがわかった。

【0102】[合成例4]下記モノマー3、メタクリル 酸(2-エチルアダマンチル)及びモノマー2の共重合 反応(4.5:4:1.5)

500mLのフラスコ中で下記モノマー3を13.0 g、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)を5.6 g、モノマー2を1. 4gトルエン100mLに溶解さ

を0.28g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合 反応を行った。得られたポリマーを精製するために、反 応混合物をメタノール中に注ぎ、得られた重合体を沈澱 させた。

【0103】更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶かし、メタノール5 L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた14.0gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が8,500であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.7の重合体であることが確認できた。また、1H-NMRの結果により、得られたポリマーはモノマー3、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及びモノマー2を45:37:18の比で含むものであることがわかった。

[0104] [化26]

Monomer3

【0105】[合成例5]下記モノマー4、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)、及びモノマー2の共重合反応(4.5:4:1.5)

500mLのフラスコ中で下記モノマー4を12.8 g、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)を5.7 g、モノマー2を1.5gトルエン100mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤のAIBN 30 を0.28g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合 反応を行った。得られたポリマーを精製するために、反 応混合物をメタノール中に注ぎ、得られた重合体を沈澱 させた。

【0106】更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶かし、メタノール5 L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた14.3gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が8.900であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.8の重合体であることが確認できた。また、1H-NMRの結果により、得られたポリマーはモノマー4、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及びモノマー2を44:42:14の比で含むものであることがわかった。

【0107】 【化27】 (CF₂)₅CF₃

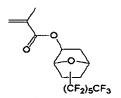
Monomer 4

【0108】[合成例6]下記モノマー5、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及びモノマー2の共重合反応(4.5:4:1.5)

500mLのフラスコ中で下記モノマー5を12.9 g、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)を5.7 g、モノマー2を1.5gトルエン100mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤のAIBN を0.28g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合 反応を行った。得られたポリマーを精製するために、反 応混合物をメタノール中に注ぎ、得られた重合体を沈澱 させた。

【0109】更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶かし、メタノール5 L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた13.2gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が8,100であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.6の重合体であることが確認できた。また、1H-NMRの結果により、得られたポリマーはモノマー5、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及びモノマー2を44:37:19の比で含むものであることがわかった。

[0110] [化28]



Monomer 5

【0111】[合成例7] モノマー4、メタクリル酸(1-エチルシクロペンチル)及びモノマー2の共重合 反応(4.5:4:1.5) 500mLのフラスコ中でモノマー4を13.9g、メタクリル酸(1-エチルシクロペンチル)を4.5g、モノマー2を1.6gトルエン100mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤のAIBNを0.31g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行った。得られたポリマーを精製するために、反応混合物をメタノール中に注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。

50 【0112】更に得られたポリマーをテトラヒドロフラ

ンに溶かし、メタノール5 L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた13.9gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が8,200であり、GP C溶出曲線より分散度(= Mw/Mn)が1.5 9の重合体であることが確認できた。また、1H-NMRの結果により、得られたポリマーはモノマー4、メタクリル酸(1-エチルシクロベンチル)及びモノマー2を42:40:18の比で含むものであることがわかった。

【0113】[参考例1]上記モノマー1の合成 窒素気流下、容量2LのSUSオートクレーブに747 gのオクタフルオロシクロペンテン及び74gのシクロペンタジエンを仕込んで容器を密封し、170℃まで加熱し72時間温度を維持した。氷冷し内圧を下げた後、内容物を2Lなす型フラスコに移して減圧蒸留を行い、193gの下記化合物(18)を得た。

【0114】窒素雰囲気下、2 Lのなす型フラスコに得られた化合物(18)の100gと1.2 Lのジクロロメタンを加えた。続いて室温でm-クロロ過安息香酸266gを加え、室温で48時間撹拌した。次に亜硫酸水素ナトリウム水溶液を室温で滴下し過剰の試薬を分解後、大過剰の酢酸エチルで希釈し、0.5 N水酸化ナトリウム水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、イオン交換水、飽和食塩水で洗浄した。得られた有機層を適量の硫酸マグネシウムで乾燥し、エバボレーターにて減圧*

* 濃縮した後シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて分離精製し、53gの下記化合物(19)を得た。

【0115】窒素雰囲気下、2 Lなす型フラスコに化合物(19)の全量とテトラヒドロフラン1.8 Lを加えた。続いて氷冷下で水素化リチウムアルミニウム6.8gを加え、0℃で3時間、室温で12時間撹拌した。次に多量のテトラヒドロフランで希釈した後、イオン交換水10mLを加え室温で1時間撹拌し過剰の試薬を分解した。続いて沈澱物をシリカゲルにて濾別し、エバボレーターにて減圧濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて分離精製し、36gの下記化合物(20)を得た。

【0116】窒素雰囲気下、1しなす型フラスコに化合物(20)の全量と157mLのメタクリル酸及び1.3gのヒドロキノンを加えた。続いて室温で18.8gの濃硫酸を加え、60℃で5時間撹拌した。次に多量の酢酸エチルで希釈した後、適量のイオン交換水を加え有機層を抽出した。続いてこの有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、イオン交換水、飽和食塩水で洗浄した。得られた有機層を硫酸マグネシウムで乾燥し、エバボレーターにて減圧濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて分離精製し、28.3gのモノマー1を得た。

[0117] [化29]

40

【0118】[参考例2]上記モノマー3、モノマー4 及びモノマー5の合成

窒素気流下、容量2 LのS USオートクレーブに19. 2 gのパーフルオロヘキシルエチレン及び1 0 0 gのジシクロペンタジエンを仕込んで容器を密封し、1 7 0 $\mathbb C$ まで加熱し2 4 時間温度を維持した。氷冷し内圧を下げた後、内容物を2 Lなす型フラスコに移して減圧蒸留を行い、1 0 9 . 5 gの下記化合物(2 1)を得た。

【0119】窒素雰囲気下、1Lのなす型フラスコに得られた化合物(21)の80gを入れ、130gのトリフルオロ酢酸を少しずつ滴下し、滴下終了後に50℃で6時間反応を行った。反応終了後、室温まで冷却し、ヘキサン400mLを添加後、有機層を水400mLで3回洗浄した。次に有機層を26%水酸化ナトリウム水溶液400mLで洗浄し、有機層をエバボレーターで乾固した。得られた有機物をメタノール400mLに溶かし、炭酸カリウムを添加して室温で12時間撹拌した。エバボレーターでメタノールを除去後。有機物をエーテ

ル400mLに溶かし、水400mLで2回洗浄を行った。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥し、エバボレーター及び真空ボンプで溶媒を除去すると下記化合物(2)の粗生成物が81g得られた。

【0120】得られた化合物(22)の全量を粗生成物のままアセトン160gに溶かし、氷浴下でJones 試薬で酸化反応を行った。30mLのイソプロバノールを加えて過剰の試薬をクエンチ後、有機物をヘキサン300mLに溶かし、水300mLで洗浄した。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で有機層を洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、ヘキサンをエバボレーターで除去し、下記化合物(23)の粗生成物78gを得た。

回洗浄した。次に有機層を26%水酸化ナトリウム水溶 【0121】得られた化合物(23)の全量を粗生成物 液400mLで洗浄し、有機層をエバポレーターで乾固 のままTHF80gに溶かし、1Lフラスコ中で別途合 した。得られた有機物をメタノール400mLに溶か 成したエチルマグネシウムブロマイドのTHF溶液中に し、炭酸カリウムを添加して室温で12時間撹拌した。 氷浴下で滴下を行った。滴下終了後5時間熟成し、ヘキエバポレーターでメタノールを除去後、有機物をエーテ 50 サン300mLを系に添加後、飽和塩化アンモニウム水

*和炭酸カリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグ

ネシウムで乾燥し、エバポレーターにて減圧濃縮した

【0123】同様の手法を用いて、化合物(22)とメ

タクリル酸クロライドとの反応により、モノマー4が得

られた。また、化合物(21)合成原料のジシクロペン

タジエンをフランに置き換えることにより、酸素架橋の

化合物(25)が得られ、上記と同様の手法を用いるこ

とにより、モノマー5が得られた。

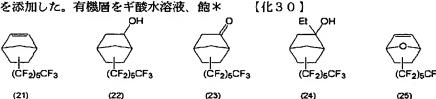
[0124]

後、減圧蒸留し、59.3gのモノマー3を得た。

溶液300mLを滴下した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、ヘキサンをエバボレーターで除去後に減圧蒸留を行うことにより、65gの下記化合物(24)を得た。

45

【0122】窒素雰囲気下、1 Lなす型フラスコに63gの化合物(24)、14.1gのアクリル酸クロライド、120gのトルエン、0.5gのフェノチアジン及び0.5gのジメチルアミノピリジンを加えた。トリエチルアミンを17.7g滴下後、80℃で3時間熱成を行った。室温まで冷却し、エーテル300mLを投入後、水300mLを添加した。有機圏をギ酸水溶液、飽*



【0125】[評価例]

ポリマー透過率測定

得られたボリマー1 gをプロビレングリコールモノメチ 20 ルエーテルアセテート (PGMEA) 20 gに十分に溶解させ、0.2 μmのフィルターでろ過してボリマー溶液を調整した。比較例用ポリマーとして、分子量10,000、分散度 (Mw/Mn)1.1の単分散ボリヒドロキシスチレンの水酸基の30%をテトラヒドロビラニル基で置換したボリマーを用意し、これを比較例用ボリマー1とした。同様に、分子量15,000、分散度1.7のポリメチルメタクリレートを比較例用ポリマー2、メタ/バラ比40/60で分子量9,000、分散度2.5のノボラックポリマーを比較例用ポリマー3と※30

※し、上記と同様の方法でポリマー溶液を調製した。

【0126】ポリマー溶液をMgF,基板にスピンコー20 ティングして塗布後、ホットプレートを用いて100℃で90秒間ベークし、厚さ100nmのポリマー膜をMgF,基板上に作成した。この基板を真空紫外光度計(日本分光製、VUV-200S)に設置し、248nm、193nm、157nmにおける透過率を測定した。表1に示す測定結果より、本発明の高分子化合物を用いたレジスト材料は、F₂(157nm)の波長においても十分な透明性を確保できることがわかった。

【表1】

[0127]

透過率 (%) 透過率(%) 透過率(%) ポリマー 248nm193nm 157 nm 合成例1ポリマー 9 2 8 5 39 合成例2ポリマー 9 2 8 6 40 合成例3ポリマー 9 2 8 4 36 合成例4ポリマー 90 90 45 合成例5ポリマー 9.0 88 46 合成例6ポリマー 8 7 9.0 43 合成例7ポリマー 8 9 8 9 42 比較例1ポリマー 9 0 5 15 12 比較例2ポリマー 9 1 8 0 比較例3ポリマー 82 6 17

【0128】レジスト調製及び露光

上記ポリマー及び下記に示す成分を表2に示す量で用いて常法によりレジスト液を調製した。次に、DUV-3 O(Brewer Science社製)を55nmの 膜厚で製膜したシリコンウエハー上に得られたレジスト 液をスピンコーティング後、ホットプレートを用いて1

00℃で90秒間ベークし、レジストの厚みを200nmの厚さにした。これにF、レーザー(リソテック社、 VUVES)で露光量を変化させながら露光し、露光後 直ちに120℃で90秒間ベークし、2.38%のテト ラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液で60秒間 50 現像を行って、露光量と残膜率の関係を求めた。膜厚が

48

Oになった露光量をEthとして、レジストの感度を求 めた。その結果を表2に示す。

* が減少し、ポジ型レジストの特性を示すことがわかっ た。

【0129】VUVES露光の結果、本発明の高分子化

[0130]

合物を用いたレジスト材料は露光量の増大に従って膜厚米

【表2】

ポリマー	酸発生剤	塩基性化合物	溶解阻止剤	溶媒	Eth感度
(重量部)	(重量部)	(重量部)	(重量部)	(重量部)	(mJ/cm²)
合成例1	PAG1)リブ・チルアミン		PGMEA	45
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	
合成例2	PAG1	トリフ・チルブミン		POMEA	23
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	
合成例3	PAG1	トリブ・テルブミン		PGMEA	33
(100)	(2)	(0.1)	·	(1,000)	
合成例1	PAG1	トリフ・テルアミン	DRI1(10)	PGMEA	40
(100)	(2)	(0.1)	D/G1(10)	(1,000)	
合成例1	PAG2	トリフ・チルブミン		PGMEA	35
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	90
合成例1	PAG1	トリエタノールアミン		PGMEA.	38
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	56
合成例4	PAG1	トリフ・チルアミン		PGMEA	25
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	20
合成例 5	PAG1	トリフ・チルブミン	_	PGMEA	22
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	
合成例 6	PAG1	トリフ・チルブミン	_	PGMEA	18
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	
合成例7	PAG1	トリフ・チルブミン	_	PGMEA	22
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	
合成例4	PAG1	トリフ・チルアミン	DRI1(10)	PGMEA	22
(100)	(2)	(0.1)	D1011(10)	(1,000)	44
合成例4	PAG2	トリフ・チルプミン	_	PGMEA.	18
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	10
合成例4	PAG1	トリエタノールアミン	-	PGMEA	26
(100)	(2)	(0.1)		(1,000)	

[0.131]

※ ※ 【化31】

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

テーマコード(参考)

G03F 7/039 601

FΙ

G03F

601

HO1L 21/027

HOIL 21/30

502R

(72)発明者 原田 裕次

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72)発明者 渡辺 淳

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72)発明者 畠山 潤

7/039

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72)発明者 河合 義夫

> 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

笹子 勝 (72)発明者

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 遠藤 政孝

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 岸村 眞治

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 大谷 充孝

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ

ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 宮澤 覚

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ

ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 堤 憲太郎

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ

ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 前田 一彦

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

セントラル硝子株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA09 AB16 AC04 AC08

AD03 BE00 BE10 BG00 CB08

CB14 CB25 CB41 CB55 CB56

CC03 FA17

4J032 BA02 BA07 BB01 BB03 CA32

CA34 CB01 CB03 CC03

4J100 AL08P AL08Q AL08R BB07P

BB17P BB18P BC03Q BC08P

BC09Q BC12P BC53P BC53R